

mahdm@iust.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۱۱/۶؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۹/۱/۲۳)

( $10^{13} \text{ W/cm}^2$ )

مورد استفاده قرار گیرند [۱ - ۴]. در سال‌های اخیر با روی کار آمدن لیزرهای سریع و پرتوان بر اهمیت این موضوع افزوده شده است. در کاربردهای عملی افزایش میزان تبدیل انرژی لیزر به پرتو ایکس بسیار مفید و ضروری است. برای تحقق این امر، میزان جذب نور در ماده هدف باید افزایش یابد. یکی از روش‌های افزایش میزان جذب لیزر، استفاده از پیش پالس است که باعث تولید یک پلاسمای گازی روی سطح هدف قبل از رسیدن پالس پرشدت اصلی می‌شود [۵]. دیدگاه دیگر تأثیر ساختار سطحی هدف‌های تحت تابش است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۶]. در این مقاله برهم‌کنش لیزر پالسی پرتوان با هدف فلزی شبیه سازی شده و تأثیر به کارگیری یک هدف فلزی با سطح نانو ساختار به

از زمانی که اولین آزمایش‌ها در زمینه برهم‌کنش لیزر با ماده انجام شد، مشخص شد که پلاسمای تولید شده به وسیله لیزر منبع بسیار خوبی برای تابش الکترومغناطیسی در ناحیه طیف پرتو ایکس است. پالس‌های اشعه ایکس که از این طریق تولید می‌شوند می‌توانند دارای انرژی تا حدود چند ژول و توانی به بزرگی چندین TW باشند. مشخصات این پالس‌ها از جمله شدت و طول پالس را می‌توان با استفاده از پارامترهای لیزر و هدف کنترل نمود. چنین خواصی سبب شد که این منابع به طور گسترده در بخش‌های پیشرفته علمی و فنی نظریه لیتوگرافی، ICF، لیزرهای پرتو  $\alpha$ ، پرتو پزشکی و علم مواد

هستند. حال می‌توان فرض کرد که در هر لایه از پلاسمای شرایط تعادلی موضعی برقرار بوده و در نتیجه پارامترهای پلاسمای در هر لایه ثابت هستند.

مقدار کل تابش ترمیزی در بازه فرکانسی ۷۱ و ۷۲ برای تمام لایه‌های پلاسمای با انتگرال‌گیری از رابطه (۱) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$w_t = \int_{x_f}^{x_i} \int_{v_1}^{v_2} \frac{8}{3} \left( \frac{2\pi}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{Z^2 e^{\epsilon}}{m^{\frac{1}{2}} c^{\frac{3}{2}}} \left( \frac{m}{kT_e} \right)^{\frac{1}{2}} \times n_i n_e g(v, T_e) \exp\left(\frac{hv}{kT_e}\right) dv dx \quad (2)$$

در این مقاله از کد هیدرودینامیکی EHYBRID [۹]، پس از اصلاح به منظور شبیه سازی برهم‌کنش لیزر-فلز و تشکیل پلاسمای استفاده شده است. این کد مجموعه‌ای کامل از معادلات حاکم بر پلاسمای شامل معادلات ماکسول، حرکت سیال، پیوستگی و معادله حالت را با توجه به شرایط مرزی حل نموده و EHYBRID پارامترهای پلاسمای را بر حسب زمان می‌دهد. کد EHYBRID برای هندسه دو بعدی طراحی شده و برای شبیه سازی اثرات پلاسمای نانو ثانیه و پیکو ثانیه (بزرگتر از ۱۰ ps) مناسب است. در این کد برای ماده هدف، نود و هشت لایه موازی در نظر گرفته شده است که لیزر از لایه نود و هشتمن به صورت عمود بر سطح لایه وارد ماده هدف می‌شود. پلاسمای نخست در لایه نود و هشتمن تشکیل می‌شود و به طرف داخل ماده هدف پیش می‌رود. در این کد فرض شده که پلاسمای تشکیل شده در هر لایه همدما باشد. ورودی این کد طوری طراحی شده است که قابلیت اعمال دو پلاسمای لیزری و نیز شبیه سازی اهداف دو لایه را نیز دارد. زمان محاسبه کد بسته به طول پلاسمای و شدت لیزر می‌تواند از ۱۰ ثانیه تا ۲ دقیقه باشد. با اعمال شرایط مختلف تابش و هدف در کد EHYBRID، پارامترهای پلاسمای ایجاد شده از جمله دما و چگالی مشخص می‌شوند. پس از آن با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری نوشته شده و با استفاده از رابطه (۲)، میزان تابش پرتو ایکس محاسبه می‌شود. هدف نانوساختار به منظور مطالعه تأثیر آن بر میزان تابش، به صورت یک هدف دولایه مت Shankل از یک زیر لایه با چگالی طبیعی  $N_s$  و یک لایه نانویی از جنس زیر

همراه استفاده از پیش پالس لیزری بر میزان افزایش تابش پرتو ایکس بررسی می‌شود.

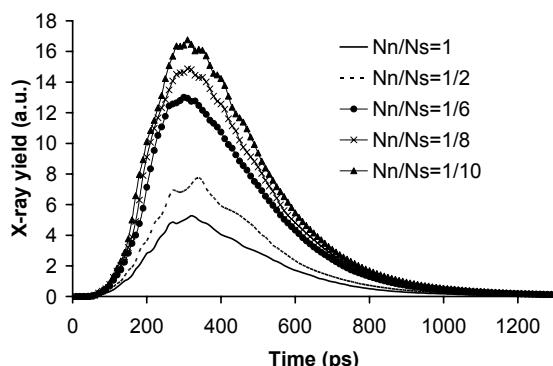
اساساً پرتو ایکس در تابش دهی فلزات با لیزر از طریق مکانیزم‌های مختلفی تولید می‌گردد که مهم‌ترین آنها تابش ترمیزی، تابش خط و تابش باز ترکیب می‌باشد [۷]. در این تحقیق به طور خاص گسیل پرتو ایکس از طریق تابش ترمیزی در نظر گرفته شده است. محاسبه تابش‌های خط و باز ترکیب مستلزم در نظر گرفتن مکانیزم‌های مختلف یونش (برخوردی و تابشی) و محاسبه جمعیت ترازهای انرژی در هر لحظه از زمان است که بسیار پیچیده و طولانی است. به همین دلیل این دو فرآیند در تحقیق جداگانه‌ای بررسی خواهند شد. البته باید توجه داشت که قسمت عمده تابش ایکس در محدوده طول موجی مورد نظر (۱-۲۰ nm)، مربوط به تابش ترمیزی می‌باشد. این فرآیند در اثر پراکندگی الکترون‌های آزاد پلاسمای در میدان الکتریکی یونهای پلاسمای حاصل می‌شود. با فرض یک توزیع ماکسولی برای الکترون‌ها و یون‌ها، مقدار تابش ترمیزی در فرکانس ۷ برای یک لایه پلاسمای به ضخامت  $dx$  که در شرایط تعادلی است از رابطه زیر به دست می‌آید [۸]:

$$w(x) dx = \frac{8}{3} \left( \frac{2\pi}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{Z^2 e^{\epsilon}}{m^{\frac{1}{2}} c^{\frac{3}{2}}} \left( \frac{m}{kT_e} \right)^{\frac{1}{2}} \times n_i n_e g(v, T_e) \exp\left(\frac{hv}{kT_e}\right) dx, \quad (1)$$

که در آن  $T_e$ ,  $n_e$ ,  $m_e$  و  $e$  به ترتیب جرم، چگالی، دما و بار الکترون می‌باشند.  $Z$ ,  $n_i$ ,  $c$ ,  $\epsilon_0$  و  $k$  نیز به ترتیب گذردهی خلا، سرعت نور در خلا، چگالی یونی، درجه یونیزاسیون و ثابت بولتزمان هستند. همچنین  $(v, T_e)$ ، عامل گانت<sup>۱</sup> نامیده می‌شود که در محاسبات با تقریب خوبی برابر یک فرض شده است.

پلاسمای به صورت لایه لایه و یک بعدی در راستای تابش لیزر در نظر گرفته می‌شود که پارامترهای توصیف کننده آن، از جمله دما و چگالی الکترونی ( $T_e$ ,  $n_e$ ) در این راستا متفاوت

۱. Gaunt factor



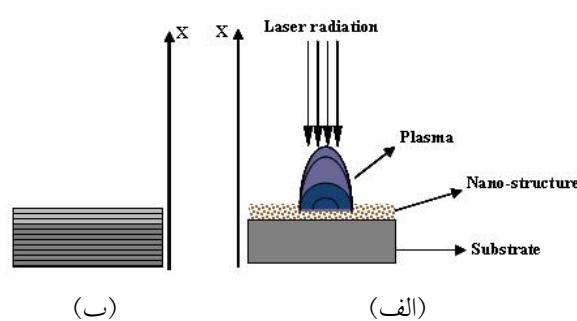
شکل ۲. میزان پرتو X تولید شده بر حسب زمان برای هدف دولایه (نانوساختار). شدت لیزر  $10^{15} \text{ W/cm}^2$  و طول پالس  $50\text{ps}$  است.

افزایش می‌یابد. برای  $N_n/N_s = \frac{1}{2}$  افزایش قابل توجهی دیده نمی‌شود اما برای حالاتی که نسبت چگالی‌ها به  $\frac{1}{6}$ ،  $\frac{1}{8}$  و  $\frac{1}{10}$  کاهش می‌یابد، افزایش قابل توجهی به وجود می‌آید. در واقع پرتو لیزر در بر هم کنش با لایه نانویی نفوذ بیشتری نسبت به هدف معمولی خواهد داشت و سهم بیشتری از انرژی لیزر جذب می‌شود و در نتیجه تشعشع ایکس در این شرایط افزایش خواهد یافت.

نمودار انرژی تابش پرتو ایکس بر حسب نسبت چگالی‌ها برای دو شدت لیزری در شکل ۳ نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با کاهش این نسبت به  $N_n/N_s = \frac{1}{2}$  تغییر چندانی در انرژی کل تابش دیده نمی‌شود ولی با کاهش بیشتر نسبت به  $N_n/N_s = \frac{1}{10}$  افزایشی تا حدود  $3\times$  برابر به وجود می‌آید. همچنین مشاهده می‌شود که روند افزایش تابش اشعه برای هر دو شدت تقریباً یکسان است.

حال تأثیر استفاده از پیش پالس بر میزان تابش پرتو ایکس از یک هدف نانو ساختار بررسی می‌شود.

به این منظور با در نظر گرفتن یک نسبت چگالی مشخص (در اینجا  $N_n/N_s = \frac{1}{6}$ ، یک پیش پالس لیزری با همان طول پالس اصلی ولی با شدت متفاوت و در فواصل زمانی مختلف، قبل از پالس اصلی به هدف تابیده می‌شود. شکل ۴ انرژی کل تابش شده را برای زمان‌های تأخیری مختلف نمایش می‌دهد.

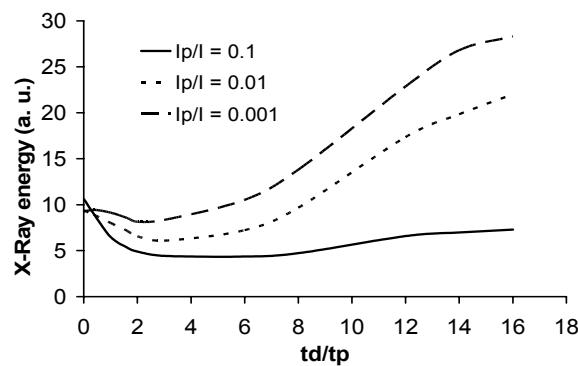


شکل ۱. (الف) هدف نانو ساختار تحت تابش لیزر که تشکیل و انبساط پلاسمای در راستای x را نشان می‌دهد. (ب) هدف نانو ساختار مدل‌سازی شده به صورت دو لایه.

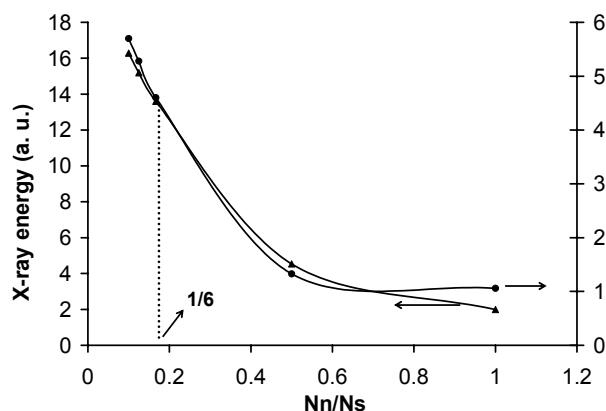
لایه اما با چگالی کمتر  $N_n$  مدل‌سازی شده است (شکل ۱). به طور معمول لایه‌های نانوساختار متتشکل از تعداد زیادی نانو-ذره هستند که ضخامتی در مقیاس نانومتر را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل با در نظر گرفتن هدف به صورت دو لایه با شرایط ذکر شده می‌توان تجمع نانوذرات روی سطح هدف را به وسیله نسبت  $N_n/N_s$  مشخص نمود. در این محاسبات، فلز مس به عنوان هدف فلزی انتخاب شده است. ضخامت هدف  $6\mu\text{m}$  انتخاب شده که شامل یک زیرلایه مسی به ضخامت  $5\mu\text{m}$  و یک لایه نانویی از جنس مس به ضخامت  $50\text{nm}$  است.

پیش پالس لیزری نیز با فواصل زمانی مختلف نسبت به پالس اصلی و نیز با شدت‌های مختلف قبل از پالس اصلی به سطح نانو ساختار تابیده می‌شود. پالس لیزر اصلی در محاسبات دارای طول  $50\text{ps}$ ، شدت  $10^{15} \text{ W/cm}^2$  و طول موج  $106\mu\text{m}$  است. نتایج حاصل از محاسبات شرایط بهینه برای تولید بیشترین مقدار اشعه ایکس را به دست خواهد داد.

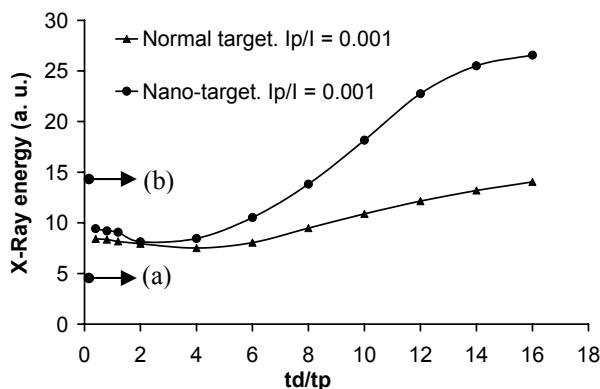
ابتدا تأثیر چگالی لایه نانویی (در واقع تجمع نانوذرات روی هدف) بدون در نظر گرفتن پیش پالس بررسی می‌شود. یک پالس لیزری پرتوان با مشخصات گفته شده به هدفی با سطح نانو ساختار تابیده می‌شود. شکل ۲ نتایج حاصل را در بازه طول موجی  $1-20\text{ nm}$  نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که با کاهش نسبت چگالی‌های لایه نانویی به زیرلایه، میزان تشعشع



شکل ۴. انرژی تابش پرتو  $\chi$  بر حسب نسبت  $tp$  که طول پالس و فاصله زمانی یا زمان تأخیری بین پیش پالس و پالس اصلی است. شدت پالس اصلی  $W/cm^2 \cdot 10^{15}$  و طول هر دو پالس  $50\text{ps}$  می باشد.



شکل ۳. انرژی تابش پرتو  $\chi$  بر حسب نسبت چگالی های لایه نانویی به زیرلایه. شدت لیزر برای منحنی با نقاط دایره ای  $W/cm^2 \cdot 10^{15}$  و برای منحنی با نقاط مثلثی برابر  $W/cm^2 \cdot 10^{14}$  است.



شکل ۵. انرژی تابش پرتو  $\chi$  بر حسب نسبت  $tp$  که همان طول پالس و  $td$  فاصله زمانی یا زمان تأخیری بین پیش پالس و پالس اصلی است. شدت پالس اصلی  $W/cm^2 \cdot 10^{15}$  می باشد.

انتخاب شده است. نقاط (a) و (b) نیز به ترتیب مقادیر مربوط به حالات هدف معمولی و نانو ساختار را بدون استفاده از پیش پالس نمایش می دهند. مقایسه منحنی مربوط به هدف معمولی و نقطه a نشان می دهد که استفاده از پیش پالس با هر مقدار فاصله زمانی  $td$  موجب افزایش تابش ایکس می شود و این افزایش برای مقادیر بزرگتر  $td$  بیشتر است. در مورد هدف نانو ساختار نیز با مقایسه منحنی مربوط به آن و نقطه b مشاهده می شود که استفاده از پیش پالس با فواصل زمانی کوتاه (تا حدود ۸ برابر طول پالس) می تواند موجب کاهش تابش پرتو ایکس از آن شود ولی با افزایش بیشتر فاصله زمانی میزان تابش تا حدود ۲ برابر افزایش می یابد.

شدت پالس اصلی و پیش پالس به ترتیب  $I_p$  و  $I_p/I$  است. نمودارها برای سه مقدار مختلف از نسبت شدت ها ( $I_p/I$ ) رسم شده اند. مشاهده می شود هنگامی که نسبت شدت ها برابر  $1/6$  باشد انرژی تابش شده روند کاهشی خواهد داشت. اما با کاهش این نسبت تا  $1/100$  می توان میزان تابش اشعه را تا حد قابل توجهی افزایش داد. محاسبات نشان می دهد که اگر نسبت شدت ها بیشتر از  $1/6$  شود میزان افزایش به صفر می رسد.

در نهایت شکل ۵ مقایسه ای بین انرژی کل تابش شده از اهداف معمولی و نانو ساختار را نشان می دهد. منحنی ها مربوط به مقادیر به دست آمده با به کار گیری پیش پالس هستند. نسبت شدت پیش پالس به پالس اصلی در هر دو حالت برابر  $1/100$  است.

مناسب نسبت به پالس اصلی می‌تواند افزایش گسیل پرتو از هدف نانو ساختار را به میزان قابل توجهی تقویت کند. هنگامی که شدت پیش پالس بیشتر از  $10^{14} \text{ W/cm}^2$  شود، فرآیند افزایش تضعیف شده و به صفر می‌رسد. فاصله زمانی نیز برای حصول مقدار بهینه پرتو ایکس نباید از حدود ۱۰ برابر طول پالس کمتر شود.

تأثیر استفاده از پیش پالس لیزری بر میزان افزایش پرتو ایکس ترمیزی از اهداف فلزی نانو ساختار تحت تابش پالس لیزری پرشدت بررسی شد. ابتدا نشان داده شد که استفاده از هدف نانو ساختار (با یک چگالی مناسب برای لایه نانویی) به جای هدف معمولی تولید پرتو ایکس را افزایش می‌دهد. سپس مشاهده شد که استفاده از یک پیش پالس لیزری با شدت و فاصله زمانی

- Nakano, *Appl. Phys. B* **78** (2004) 885.  
 7. I C F Turcu, *X-Rays from Laser Plasmas, Generation and Application*, John Wiley & Sons, New York (1999).  
 8. S Ichimaru, *Basic Principles of Plasmas Physics: A Statistical Approach*. *J. Plasma Physics*, **13** (1975).  
 9. J Pert, *J. Fluid Mech.* **131** (1983) 401.

1. S Sailaja et al., *Meas. Sci. Technol.* **9** (1998) 1462.
2. P Gibbon, E Forster, *Plasma Phys. Control. Fusion* **38** (1996) 769.
3. J Lindl, *Phys. Plasmas* **2** (1995) 3933.
4. H Diado, *Rep. Prog. Phys.* **65** (2002) 1513.
5. J F Pelletier, M Chaker, and J C Kieffer, *J. Appl. Phys.* **81** (1997) 5980.
6. T Nishikawa, S Suzuki, Y Watanabe, O Zhou, and H